

# PV-2000无接触硅片自动测试系统

产品名称	PV-2000无接触硅片自动测试系统
公司名称	北京合能阳光新能源技术有限公司
价格	.00/套
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:进口 型号:PV2000
公司地址	北京市通州区工业开发区光华路16号综合楼A207
联系电话	010-60546837 13718294863

## 产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	进口
型号	PV2000	外形尺寸	35*45*54 ( mm )
重量	35 ( Kg )	产品用途	硅片测试
规格	tao		

### 产品介绍:

pv-2000系列无接触硅片厚度ttv电阻率综合测试系统为太阳能/光伏硅片及其他材料提供快速、多通道的厚度、(总厚度变化)ttv、弯曲度及无接触电阻率测量功能。并提供基于tcp/ip的数据传输接口及基于windows的控制软件,用以进行在线及离线数据管理功能。

### 产品特点:

使用mti instruments独有的推/拉电容探针技术 每套系统提供最多三个测量通道 可进行最大、最小、平均厚度测量和ttv测量 可进行翘曲度测量(需要3探头) 用激光传感器进行线锯方向和深度监视(可选) 集成数据采集和电气控制系统 为工厂测量提供快速以太网通讯接口,速率为每秒5片 可增加的直线厚度扫描数量 与现有的硅片处理设备有数字i/o接口 基于windows的控制软件提供离线和在线的数据监控 提供标准及客户定制的探头 提供基于windows的动态链接库用于与控制电脑集成 无接触,用涡电流法测量硅片电阻率

### 技术参数:

晶圆硅片测试尺寸: 50mm- 300mm.

厚度测试范围: 1.7mm, 可扩展到2.5mm.

厚度测试精度: +/-0.25um

厚度重复性精度：0.050um

测量点直径：8mm

ttv测试精度: +/-0.05um ttv重复性精度:0.050um

弯曲度测试范围：+/-500um [+/-850um]

弯曲度测试精度：+/-2.0um

弯曲度重复性精度：0.750um

电阻率测量范围：0.1-50ohm-cm 电阻率测量精度：2%

电阻率测量重复精度：1%

晶圆硅片类型：单晶或多晶硅

可用在：切片后、磨片前、后，蚀刻，抛光以及出厂、入厂质量检测等

平面/缺口：所有的半导体标准平面或缺口

连续5点测量

典型客户:

美国，欧洲，亚洲及国内太阳能及半导体客户。

详情欢迎来电咨询：

北京合能阳光新能源技术有限公司

北京市通州区工业开发区光华路16号

电话：010-60546837 -104 传真：01060546837-608

联系人：肖经理18610357221 qq：454972757

email：[xiaozongyong@henergysolar.com](mailto:xiaozongyong@henergysolar.com)

公司网站：<http://www.henergysolar.com>